

บทที่ 4

ผลการวิจัย

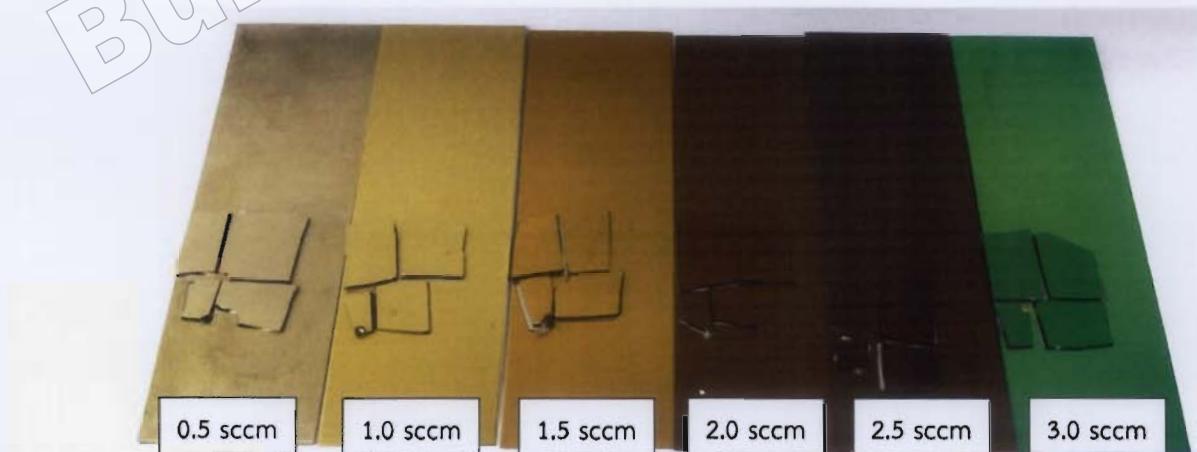
บทนี้กล่าวถึงข้อมูลและผลที่ได้จากการทดลองตามแนวทางการศึกษาในบทที่ 3 ประกอบด้วย ผลของอัตราไหลแก๊สในไตรเจน และ ผลของเวลาการเคลือบ ต่อลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางชอร์ โโคเนียม ในไตรค์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ผลของอัตราไหลแก๊สในไตรเจน

ส่วนนี้เป็นผลการทดลองเคลือบฟิล์มบางชอร์ โโคเนียม ในไตรค์ ด้วยวิธีรีแอคติฟดีซี แมgnิตรอนสปีกเตอริง เมื่อแปรค่าอัตราไหลแก๊สในไตรเจน เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมฟิล์มบางชอร์ โโคเนียม ในไตรค์ และศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางชอร์ โโคเนียม ในไตรค์ ที่เคลือบได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

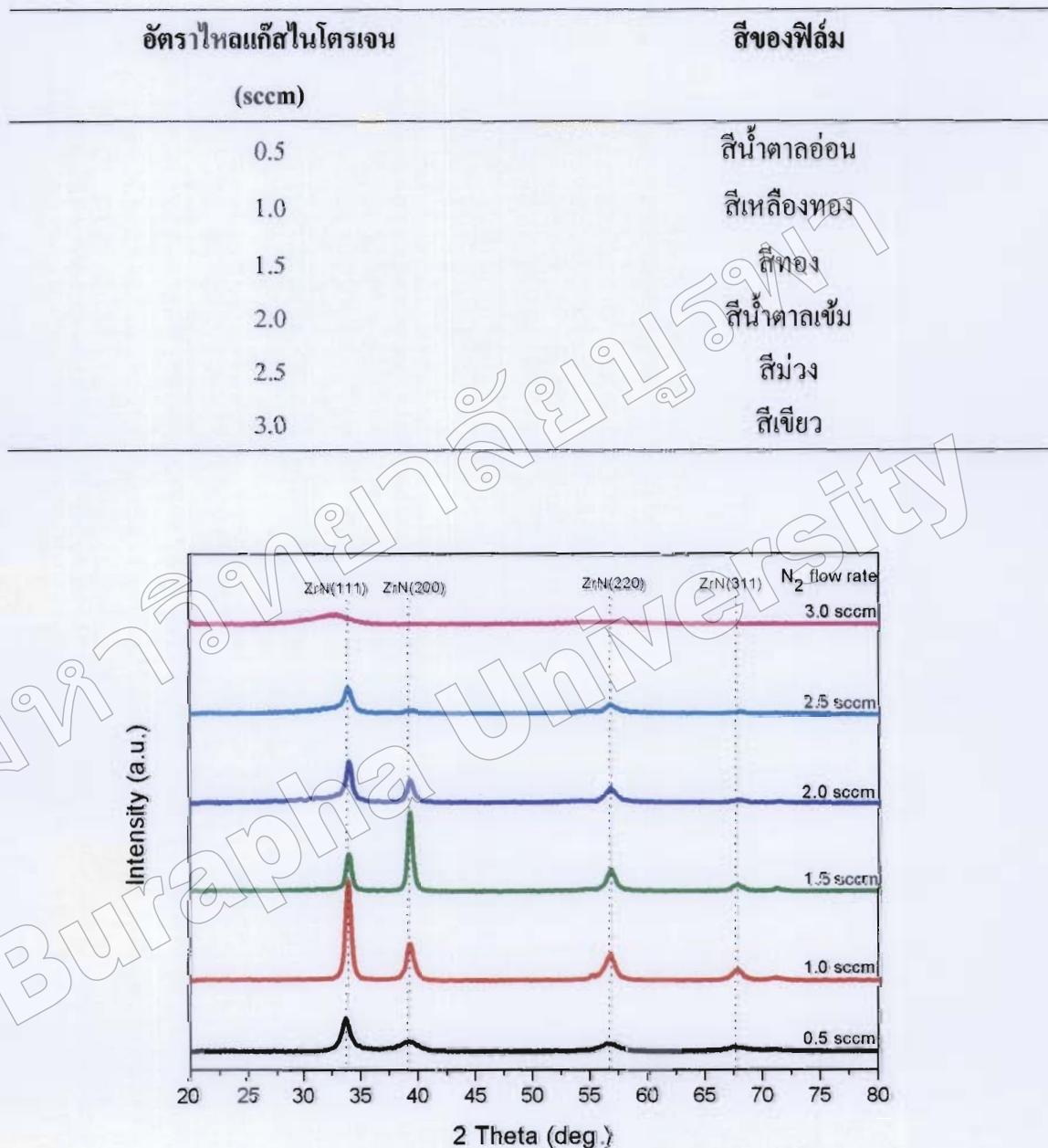
1. ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มบางชอร์ โโคเนียม ในไตรค์

ฟิล์มบางชอร์ โโคเนียม ในไตรค์ ที่เคลือบได้จากการแปรค่าอัตราไหลแก๊สในไตรเจน เมื่อสังเกตด้วยตาพบว่าผิวน้ำของฟิล์มมีลักษณะเรียบเนียน สีของฟิล์ม ที่เคลือบได้แปรไปตาม อัตราไหลแก๊สในไตรเจน โดยเมื่ออัตราไหลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 0.5 sccm ฟิล์มมีสีน้ำตาลอ่อน เมื่ออัตราไหลแก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้น สีของฟิล์มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง ทอง น้ำตาลเข้ม ม่วงและเขียว ดังแสดงในภาพที่ 4-1



ภาพที่ 4-1 ลักษณะและสีของฟิล์มบางชอร์ โโคเนียม ในไตรค์ ที่อัตราไหลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ

ตารางที่ 4-1 สีของฟิล์มบางเชอร์โคเนียม ในไตรค์ที่อัตราไนโตรเจนต่าง ๆ



ภาพที่ 4-2 รูปแบบการเปลี่ยนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางเชอร์โคเนียม ในไตรค์ที่อัตราไนโตรเจนต่าง ๆ

2. โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางชেอร์โคเนียมในไตรค์

ฟิล์มบางชีโร์โคเนียมในไตรค์ เคลือบด้วยวิธี รีแอคติฟดีซีเมกนิตรอนสปีคเตอเริง เมื่อกำหนดให้อัตราไหลดแก๊สอาร์กอนคงที่เท่ากับ 20 sccm และแปรค่าอัตราไหลดแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 0.5 sccm, 1.0 sccm, 1.5 sccm, 2.0 sccm, 2.5 sccm และ 3.0 sccm ตามลำดับ มีผลดังนี้

โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางชีโร์โคเนียมในไตรค์ที่ได้ทั้งหมดจากเทคนิค XRD ได้รูปแบบการเลี้ยวบนรังสีเอกซ์ดังแสดงในภาพที่ 4-2 พบรูปแบบการเลี้ยวบนรังสีเอกซ์ที่มุม 33.83° , 39.10° , 56.24° และ 67.52° ตรงกับรูปแบบการเลี้ยวบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบ เชอร์โคเนียมในไตรค์ ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 78-1420 ซึ่งมีโครงสร้างผลึกแบบ เพชรเซนเตอร์คิวบิก (FCC) ที่รัฐ (111), (200), (220) และ (311) ทุกเงื่อนไขการเคลือบยกเว้นที่ อัตราไหลดแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 3.0 sccm ที่พบรูปแบบการเลี้ยวบนรังสีเอกซ์เฉพาะที่มุม 39.10° ซึ่งตรงกับเชอร์โคเนียมในไตรค์รัฐ (111) โดยพบว่าเมื่ออัตราไหลดแก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้น ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวบนรังสีเอกซ์ที่มุม 33.83° ซึ่งตรงกับเชอร์โคเนียมในไตรค์รัฐ (111) และมุม 39.10° ซึ่งตรงกับเชอร์โคเนียมในไตรค์รัฐ (200) มีค่าเพิ่มขึ้นแล้วคล่อง โดยที่อัตราไหลดแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 1.0 sccm ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวบนรังสีเอกซ์รัฐ (111) มีค่าสูงสุด ส่วนที่อัตราไหลดแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 1.5 sccm ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวบนรังสีเอกซ์รัฐ (200) มีค่าสูงสุด ขณะที่ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวบนรังสีเอกซ์ที่มุม 56.24° ซึ่งตรงกับเชอร์โคเนียมในไตรค์รัฐ (220) และมุม 67.52° ซึ่งตรงกับเชอร์โคเนียมในไตรค์รัฐ (311) มีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราไหลดแก๊สในไตรเจนเพียงเล็กน้อย

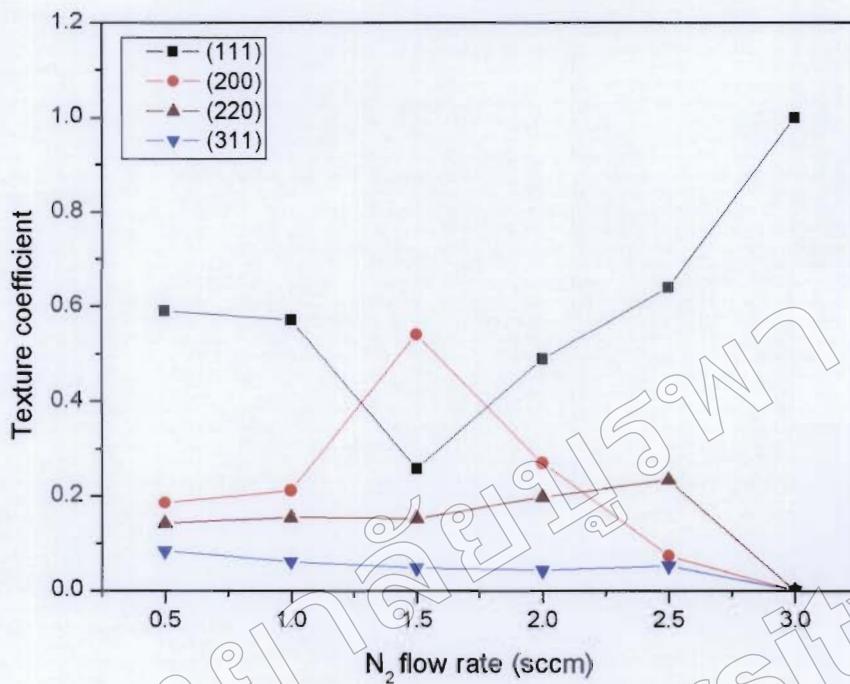
สำหรับ Texture coefficient ของฟิล์มเชอร์โคเนียมในไตรค์ หาได้จากอัตราส่วนความเข้มการเลี้ยวบนรังสีเอกซ์ของรัฐที่สนใจต่อความเข้มการเลี้ยวบนรังสีเอกซ์ของรัฐ (111) ทั้งหมดพบว่าที่รัฐ (111) ที่อัตราไหลดแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 1.5 sccm พบว่าที่รัฐ (111) มีค่า Texture coefficient ต่ำสุด เท่ากับ 0.25 ขณะที่รัฐ (200) มีค่า Texture coefficient สูงสุดเท่ากับ 0.54 ในขณะที่รัฐ (220) และ (311) เมื่ออัตราไหลดแก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้นค่า Texture coefficient มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวบนรังสีเอกซ์ ตารางที่ 4-2 แสดงค่า Texture coefficient เป็นไปตามอัตราไหลดแก๊สในไตรเจน

ค่าคงที่แล็ตทิซของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรด์ หาได้จากสูตรการคำนวณหาระยะห่างระหว่างรั้งนาบผลึก ในระบบผลึกที่มีโครงสร้างแบบเฟชเซนเตอร์คิวบิก โดยรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่เคลือบได้ดังแสดงในตารางที่ 4-3

สำหรับขนาดผลึกของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรด์ หาจากสมการของ Seherrer จากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่ได้พบว่า ขนาดผลึกของฟิล์มที่เคลือบได้มีค่าอยู่ในช่วง 6 nm ถึง 36 nm ดังแสดงในตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-2 Texture coefficient ของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรด์รั้งนาบต่าง ๆ เมื่อเปรียบค่าอัตราไฟลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ

อัตราไฟลแก๊สในไตรเจน (scm)	Texture coefficient			
	ZrN (111)	ZrN (200)	ZrN (220)	ZrN (311)
0.5	0.59	0.18	0.14	0.08
1.0	0.57	0.21	0.15	0.06
1.5	0.25	0.54	0.15	0.05
2.0	0.48	0.27	0.20	0.04
2.5	0.64	0.07	0.23	0.05
3.0	1.00	0.00	0.00	0.00



ภาพที่ 4-3 Texture coefficient ของฟิล์มบางชีว์โคเนียนในไตรค์ที่อัตราไหลดแก๊สในไตรเจนต่างๆ

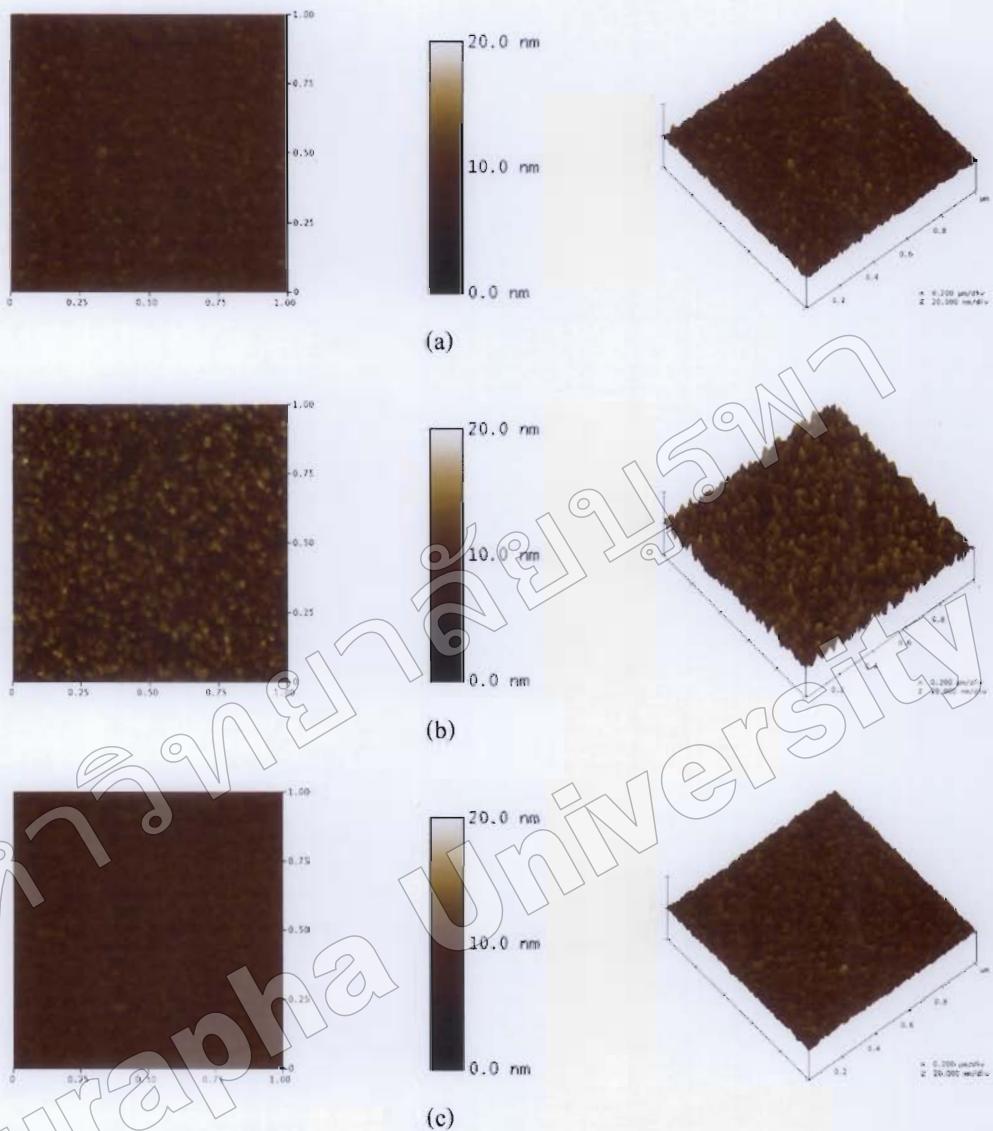
ตารางที่ 4-3 ค่าคงที่แลตทิกและขนาดผลึกของฟิล์มบางชีว์โคเนียนในไตรค์ที่อัตราไหลดแก๊สในไตรเจนต่างๆ

อัตราไหลดแก๊สในไตรเจน (sccm)	ค่าคงที่แลตทิก (Å)	ขนาดผลึก (nm)
0.5	4.592	23
1.0	4.590	36
1.5	4.590	36
2.0	4.580	33
2.5	4.580	30
3.0	4.902	6

3. ความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรด์

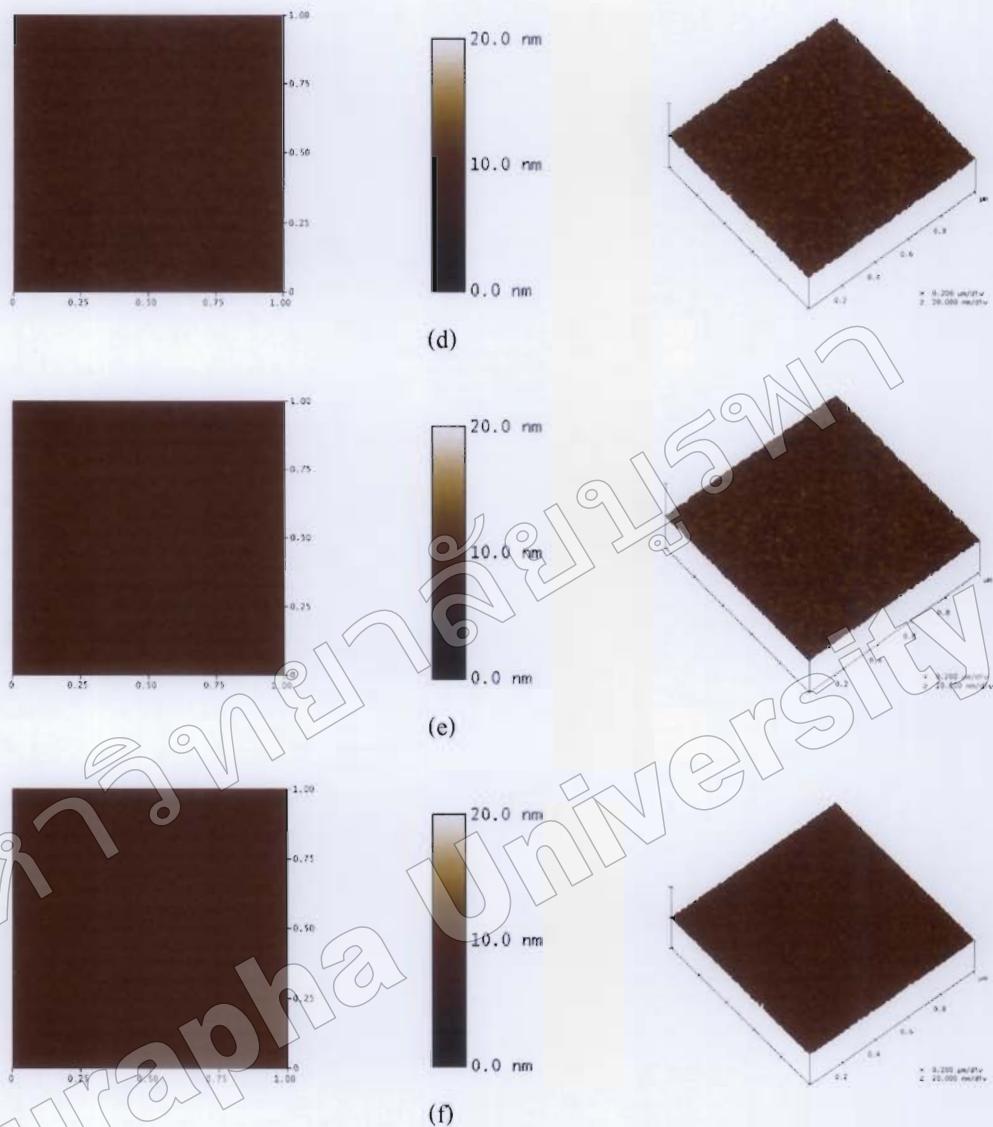
ภาพที่ 4-4 แสดงลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรด์จากการศึกษาด้วยเทคนิค AFM พบว่าฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรด์ที่เคลือบด้วยอัตราไหลดเก๊สในไตรเจนเท่ากับ 0.5 sccm สารเคลือบที่ฟอร์มตัวเป็นฟิล์มบนผิวน้ำของวัสดุรองรับมีลักษณะแหนมนูนคล้ายภูเขา กระจายตัวไม่สม่ำเสมอ ขณะที่อัตราไหลดเก๊สในไตรเจนเท่ากับ 1.0 sccm สารเคลือบมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มแหนมนูนคล้ายหัวผิวน้ำของฟิล์มทำให้พื้นผิวฟิล์มมีลักษณะคล้ายภูเขา (แหนมนูน) และหุบเขา (ร่องลึก) เมื่ออัตราไหลดเก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้นเป็นฟิล์ม 1.5 sccm พบว่าสารเคลือบจับตัวเป็นกลุ่มก้อนมีลักษณะกลมมน ขณะที่อัตราไหลดเก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้นเป็น 2.0 sccm – 3.0 sccm ลักษณะพื้นผิวฟิล์มเรียบขึ้นตามลำดับ

สำหรับความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรด์ เมื่ออัตราไหลดเก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้นพบว่าความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มมีแนวโน้มลดลง โดยความหนาฟิล์มลดลงจาก 326 nm เป็น 173 nm ขณะที่ความหยาบผิวของฟิล์มลดลงตามอัตราไหลดเก๊ส ในไตรเจนที่เพิ่มขึ้น โดยความหยาบผิวเฉลี่ยมีขนาดลดลงจาก 0.80 nm เป็น 0.34 nm ยกเว้นที่ อัตราไหลดเก๊สในไตรเจนเท่ากับ 1.0 sccm พบว่าฟิล์มมีค่าความหยาบผิวสูงสุดมีค่า 1.92 nm แสดงดังตารางที่ 4-4



ภาพที่ 4-4 สักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางชอร์โโคเนียบในไตรด์ที่อัตราไอลเก็สในโตรเจนต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM

(a) 0.5 sccm (b) 1.0 sccm (c) 1.5 sccm (d) 2.0 sccm (e) 2.5 sccm (f) 3.0 sccm



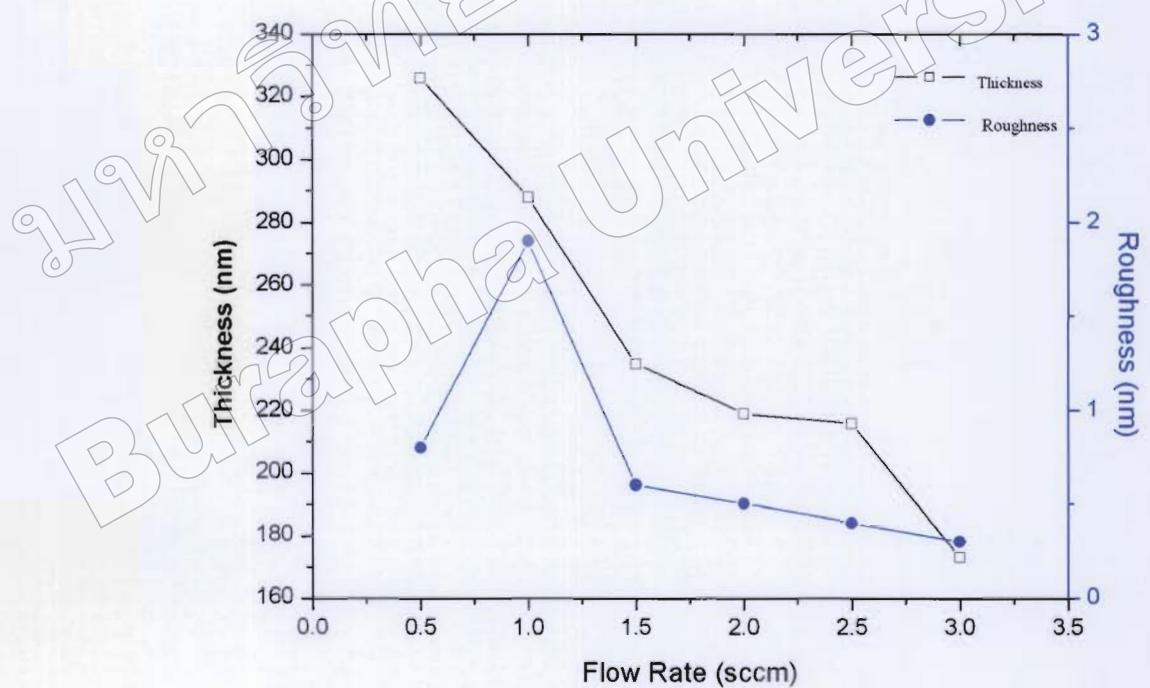
ภาพที่ 4-4 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์

ที่อัตราไหเลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM

(a) 0.5 sccm (b) 1.0 sccm (c) 1.5 sccm (d) 2.0 sccm (e) 2.5 sccm (f) 3.0 sccm

ตารางที่ 4-4 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์
ที่อัตราการไหลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ

อัตราการไหลแก๊สในไตรเจน (scm)	ความหนา (nm)	ความหยาบผิว (nm)
0.5	326	0.80
1.0	288	1.92
1.5	235	0.63
2.0	219	0.53
2.5	216	0.40
3.0	173	0.34



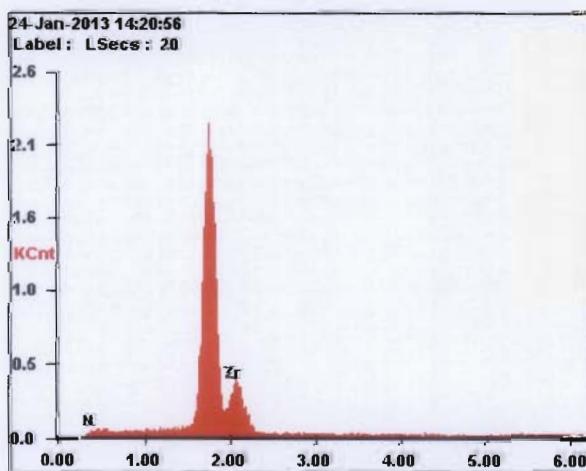
ภาพที่ 4-5 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์
ที่อัตราการไหลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ

4. องค์ประกอบของพิล์มนางเซอร์โคเนียมในไตรค์

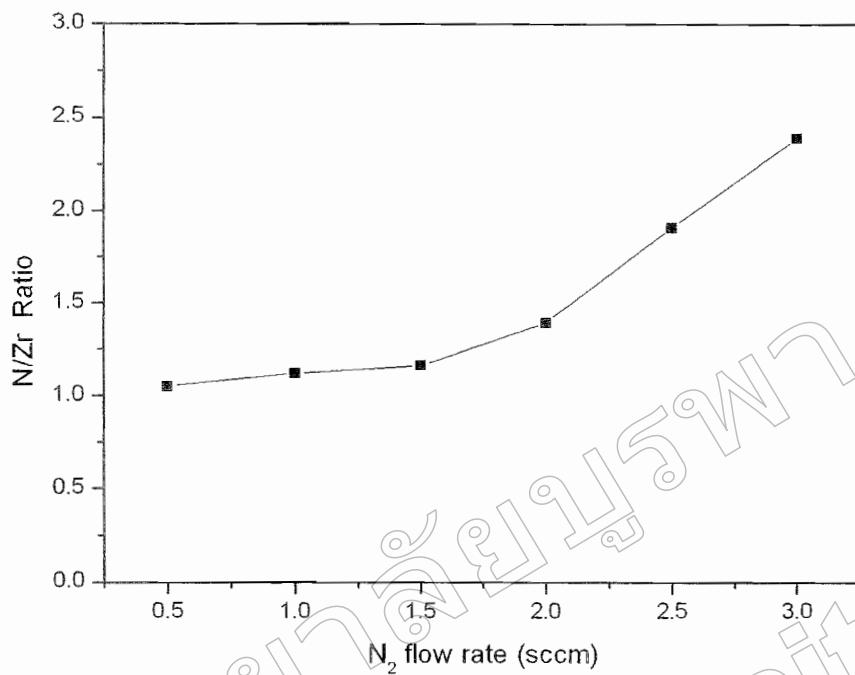
สำหรับการศึกษาองค์ประกอบของพิล์มนางเซอร์โคเนียมในไตรค์ด้วยเทคนิค EDX พบว่าพิล์มที่เคลือบได้มีเซอร์โคเนียมและในไตรเจนเป็นองค์ประกอบของพิล์มนางเซอร์โคเนียมโดยค่าเบอร์เซ็นต์โดยจำนวนอะตอม ($a\%$) ของเซอร์โคเนียมและในไตรเจนในพิล์มที่เคลือบได้ แสดงดังตารางที่ 4-5 ส่วนภาพที่ 4-6 เป็นตัวอย่างผล EDX ของพิล์มนางเซอร์โคเนียมในไตรค์ เคลือบที่อัตราไฮโลเกส ในไตรเจนเท่ากับ 3 sccm โดยเมื่ออัตราไฮโลเกสในไตรเจนเพิ่มขึ้นพบว่าอัตราส่วน N : Zr มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 1.05 เป็น 2.39 แสดงดังภาพที่ 4-7

ตารางที่ 4-5 องค์ประกอบทางเคมีและอัตราส่วนของ N:Zr ของพิล์มนางเซอร์โคเนียมในไตรค์ ที่อัตราไฮโลเกสในไตรเจนต่างๆ

อัตราไฮโลเกสในไตรเจน (sccm)	Zr	เบอร์เซ็นต์โดยจำนวนอะตอม ($a\%$)	N : Zr
0.5	48.81	51.19	1.05
1.0	47.04	52.96	1.12
1.5	46.37	53.63	1.16
2.0	41.87	58.13	1.39
2.5	34.37	65.63	1.91
3.0	29.49	70.51	2.39



ภาพที่ 4-6 ตัวอย่างผล EDX ของพิล์มนางเซอร์โคเนียมในไตรค์เคลือบที่อัตราไฮโลเกสเท่ากับ 3 sccm



ภาพที่ 4-7 อัตราส่วน N/Zr ของฟิล์มบางชেอร์โโคเนียมในไตรค์ท่ออัตราไนโอลแก๊ส ในไตรเจนต่าง ๆ วิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDX

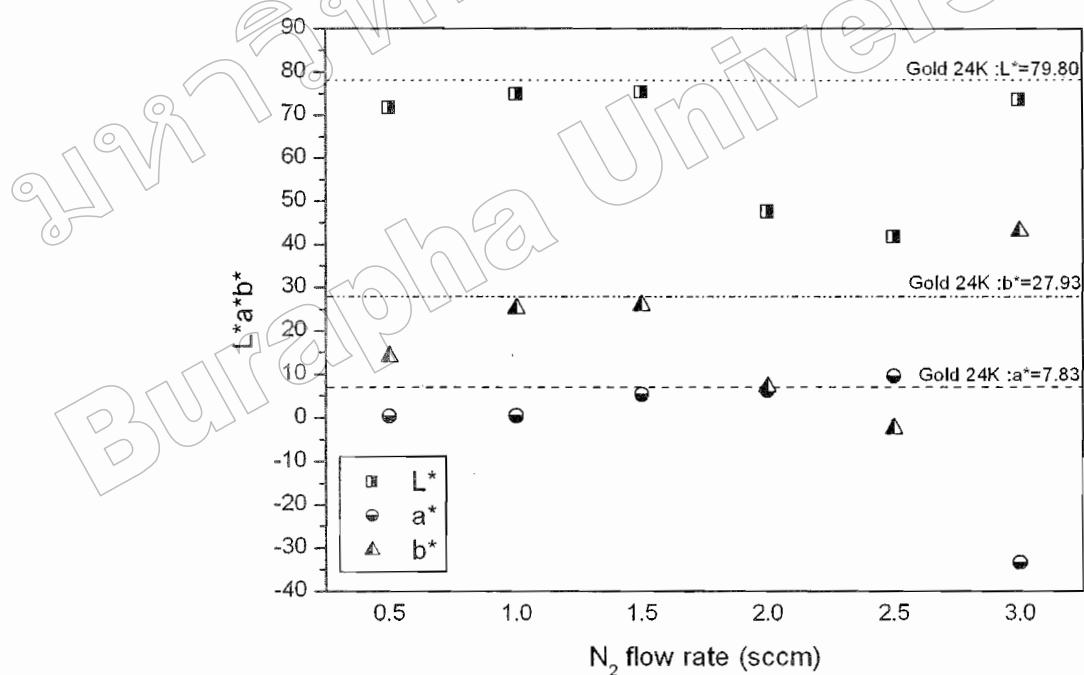
5. สีของฟิล์มบางชे�อร์โโคเนียมในไตรค์

สีของฟิล์มบางชे�อร์โโคเนียมในไตรค์ ในงานวิจัยนี้นักวิจัยได้ใช้ระบบ CIE L*a*b* ที่วัดจาก เครื่อง spectrophotometer จากงานวิจัยพบว่าค่า L*a*b* ของฟิล์มที่เคลือบได้เปลี่ยนไปตามอัตราไนโอลแก๊สในไตรเจน แสดงดังตารางที่ 4-6

การเปรียบเทียบค่า L*a*b* ของฟิล์มบางชे�อร์โโคเนียมในไตรค์ กับค่า L*a*b* ของ ทอง 24 กะรัต พบร่วมกับอัตราไนโอลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 1.5 sccm ฟิล์มบางชे�อร์โโคเนียมในไตรค์ มีค่า L* = 75.21, a * = 5.34 และ b* = 25.87 ใกล้เคียงกับค่า L*a*b* ของทอง 24 กะรัตมากที่สุด โดยที่ทอง 24 กะรัต มีค่า L* = 79.80, a * = 7.83 และ b* = 27.93 (Li and Zhang., 1994) ตามลำดับ แสดงดังภาพที่ 4-8

ตารางที่ 4-6 สีของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรด์ที่อัตราไหลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ

อัตราไหลแก๊สในไตรเจน (sccm)	ปริภูมิสีระบบ $L^*a^*b^*$		
	L^*	a^*	b^*
0.5	71.62	0.32	14.01
1.0	74.87	0.42	25.13
1.5	75.21	5.53	25.87
2.0	47.67	6.24	7.12
2.5	41.88	9.59	-2.54
3.0	73.53	-33.45	43.13



ภาพที่ 4-8 สีของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรด์ที่อัตราไหลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ ในระบบ CIE $L^*a^*b^*$ เปรียบเทียบกับสีของทอง 24 กะรัต

ผลของเวลาเคลือบ

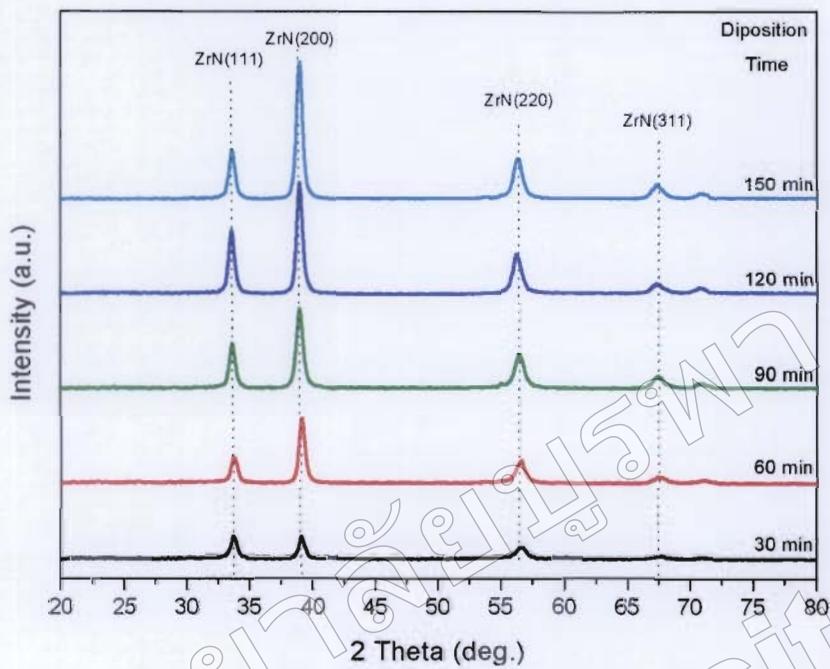
ส่วนนี้เป็นการเสนอผลการศึกษาโครงสร้างของฟิล์มบางชีวอร์โโคเนียมในไตรค์ เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีเมกนิครอนสปีตเตอริง เมื่อการแปรค่าเวลาเคลือบ เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมฟิล์มบางชีวอร์โโคเนียมในไตรค์ และศึกษาโครงสร้างของฟิล์มบางไทดเจเนียมในไตรค์ที่เคลือบได้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มบางชีวอร์เนียมในไตรค์

ฟิล์มบางชีวอร์โโคเนียมในไตรค์ที่เคลือบได้จากการแปรค่าเวลาเคลือบ เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่าผิวน้ำของฟิล์มนี้มีลักษณะเรียบเนียน สีของฟิล์มนางที่เคลือบได้มีความใกล้เคียงกัน โดยเมื่อเวลาเคลือบเพิ่มขึ้น ฟิล์มนี้มีลักษณะสว่างขึ้นดังแสดงในภาพที่ 4-9



ภาพที่ 4-9 ลักษณะและสีของฟิล์มบางชีวอร์โโคเนียมในไตรค์ที่เวลาเคลือบต่างๆ



ภาพที่ 4-10 พนรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางช่อร์โคเนียมในไตรด์ที่เวลาเคลื่อนต่าง ๆ

2. โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางช่อร์โคเนียมในไตรด์

ฟิล์มบางช่อร์โคเนียมในไตรด์ เคลื่อนด้วยวิธีรีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตอرون สปัตเตอริง

โดยกำหนดให้อัตราไบแอกซ์โซร์กอนต่อแก๊สในโตรเรนจงที่เท่ากับ 20 : 1.5 sccm และแปรค่าเวลาเคลื่อนเท่ากับ 30 นาที, 60 นาที, 90 นาที, 120 นาที และ 150 นาที ตามลำดับ มีผลดังนี้

ผลการศึกษาโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางช่อร์โคเนียมในไตรด์ ที่ได้ทั้งหมดด้วยเทคนิค XRD พนรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ดังแสดงในภาพที่ 4-9 ในกรณีของฟิล์มชุดที่เคลื่อนด้วยเวลาเคลื่อนเท่ากับ 30 นาที พนรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุน 33.83° , 39.10° , 56.24° และ 67.52° ตรงกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบเชอร์โคเนียมในไตรด์ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 78-1420 ซึ่งมีโครงสร้างผลึกแบบเฟชเซนเตอร์คิวบิก (fcc) ที่ร่นนาน (111), (200), (220) และ (311) ตามลำดับ เมื่อเวลาเคลื่อนเพิ่มเป็น 60 นาที บังพนรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุนเดินทั้งหมด เต็มความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุน 39.10° ร่นนาน (200) และ 33.83° ร่นนาน (111) มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุน 56.24° ร่นนาน (220) และมุน 67.52° ร่นนาน (311) มีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และเมื่อเวลาเคลื่อนเพิ่มเป็น 120 นาที พนรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุน 39.10° ร่นนาน (200) มีค่าลดลง เมื่อใช้

เวลา 150 นาที พบร่วมรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 33.83° ระหว่าง (111) มีค่าลดลง ในขณะที่ มุม 39.10° ระหว่าง (200) มีค่าเพิ่มขึ้น

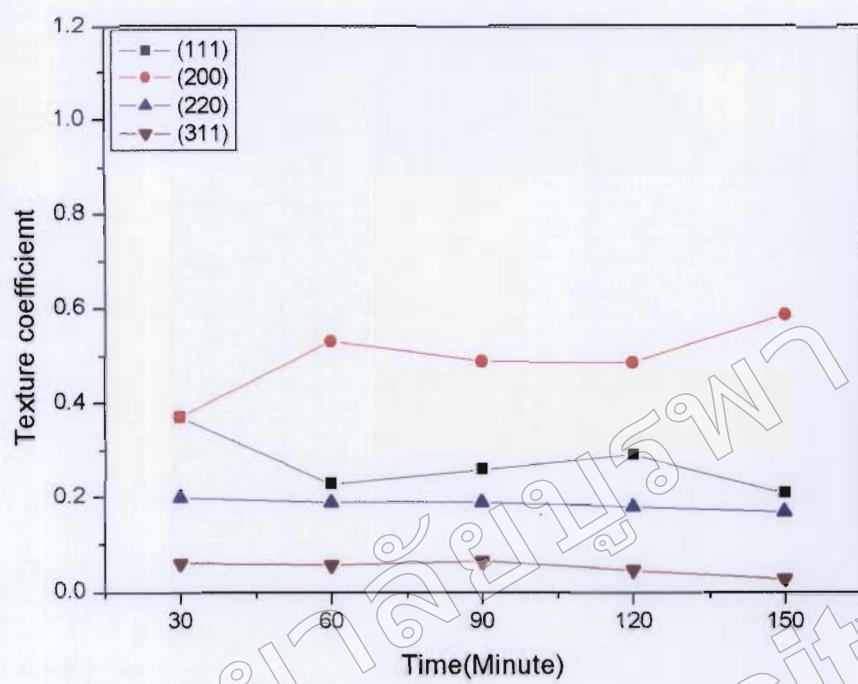
สำหรับ Texture coefficient ของฟิล์มเซอร์โคเนียมในไตรด์ หาได้จากอัตราส่วน ความเข้ม การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของระบบที่สนใจต่อความเข้มการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ของระบบหักหมุด เมื่อเวลาเคลือบเพิ่มขึ้นจาก 30 นาที เป็น 150 นาที พบร่วมที่ระบบ (111) มีค่า Texture coefficient อยู่ในช่วง 0.21 ถึง 0.37 และพบร่วมที่ระบบ (200) มีค่า Texture coefficient อยู่ในช่วง 0.37 ถึง 0.59 ขณะที่ระบบ (220) และ (311) มีค่า Texture coefficient เป็นไปเปลี่ยนแปลง เพียงเล็กน้อย สอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ดังตารางที่ 4-7 แสดงค่า Texture coefficient เป็นไปเปลี่ยนตามเวลาเคลือบ

ค่าคงที่แล็ตทิชของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมในไตรด์ หาได้จากสูตรการคำนวณหาระยะห่างระหว่างระบบผลึกในระบบผลึกที่มีโครงสร้างแบบเฟซเซนเตอร์คิวบิก จากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่เคลือบได้ พบร่วมที่เคลือบมีค่าคงที่แล็ตทิชสอดคล้องตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 78-1420 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง $4.524 \text{ \AA} - 4.648 \text{ \AA}$ ดังแสดงในตารางที่ 4-8

สำหรับขนาดผลึกของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมในไตรด์ หาจากสมการของ Scherrer จากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่ได้พบร่วมฟิล์มบางที่เคลือบโดยเปรค่าเวลาเคลือบขนาดผลึกมีค่าตั้งแต่ 31 nm ถึง 32 nm ดังแสดงในตารางที่ 4-8

ตารางที่ 4-7 Texture coefficient ของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมในไตรด์ระบบต่างๆ
เมื่อเปรค่าเวลาเคลือบ

เวลาเคลือบ (นาที)	Texture coefficient			
	ZrN (111)	ZrN (200)	ZrN (220)	ZrN (311)
30	0.37	0.37	0.20	0.06
60	0.23	0.53	0.19	0.06
90	0.26	0.49	0.19	0.07
120	0.29	0.49	0.18	0.05
150	0.21	0.59	0.17	0.03



ภาพที่ 4-11 Texture coefficient ของฟิล์มบางเชอร์โคเนียม ในไตรด์ที่เวลาเคลื่อนต่าง ๆ

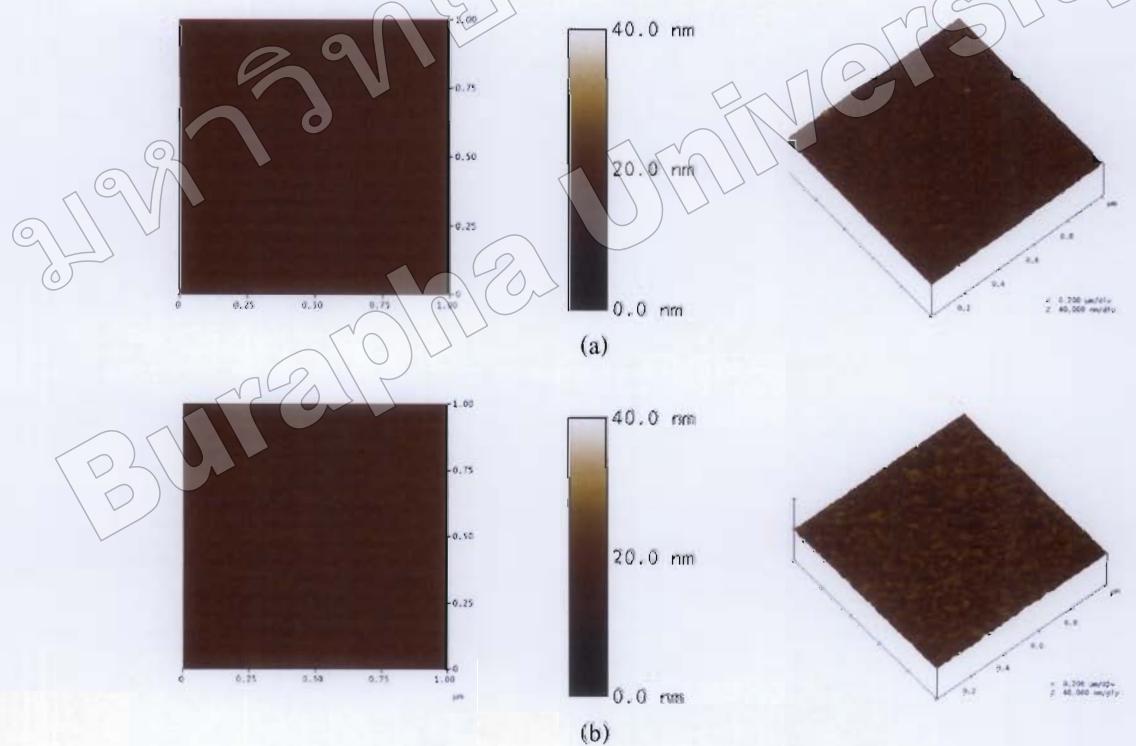
ตารางที่ 4-8 ค่าคงที่แผลตพิชและขนาดผลึกของฟิล์มบางเชอร์โคเนียม ในไตรด์ที่เวลาเคลื่อนต่าง ๆ

เวลาเคลื่อน (นาที)	ค่าคงที่แผลตพิช (Å)	ขนาดผลึก (nm)
30	4.619	32
60	4.648	32
90	4.595	31
120	4.524	31
150	4.617	31

3. ความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์

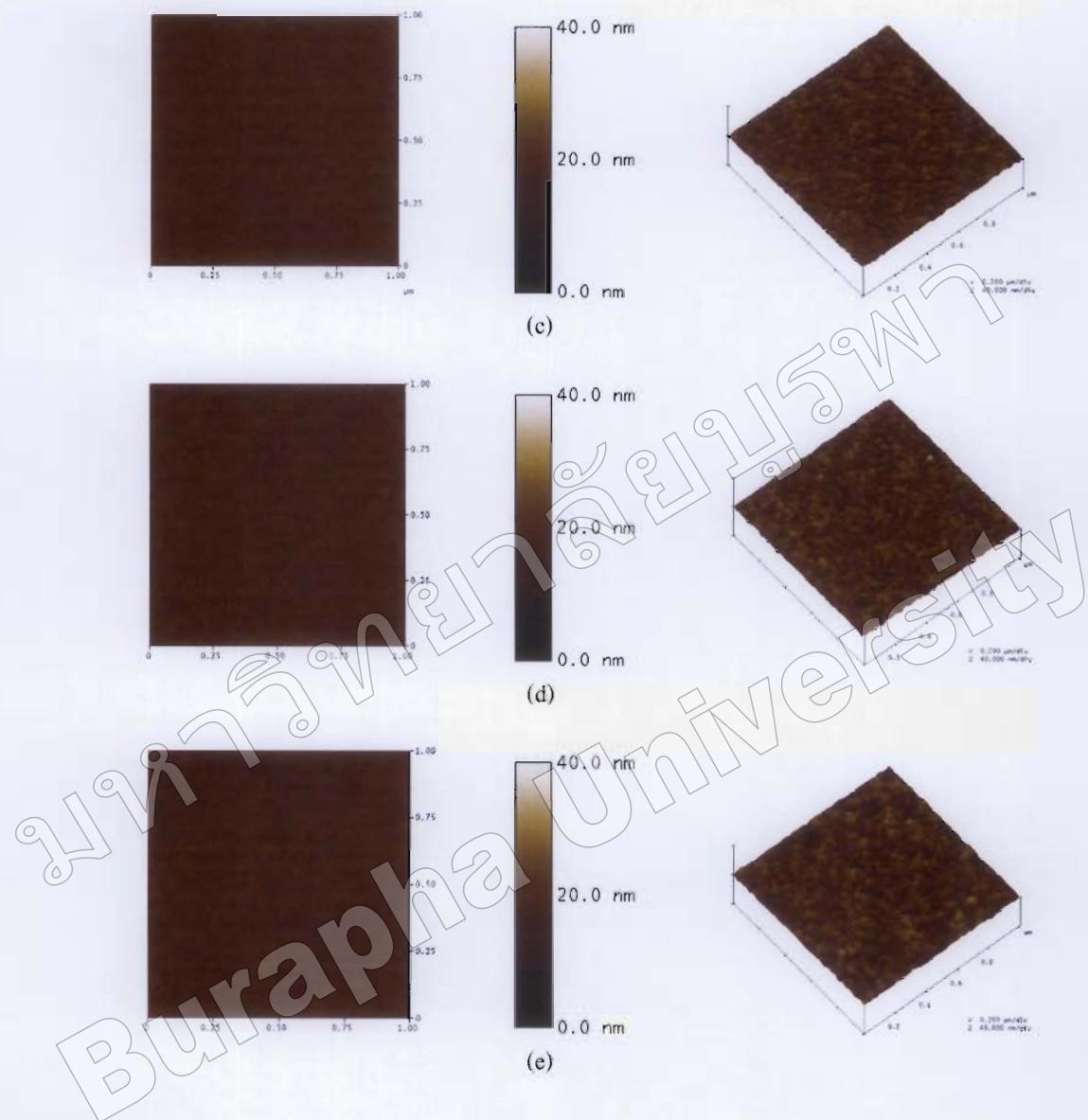
ภาพที่ 4-12 แสดงลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์ ที่ได้จากการศึกษาด้วยเทคนิค AFM ในแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ พบว่าฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์ที่เคลือบด้วยเวลาเคลือบทั่งกับ 30 นาที เกรนของฟิล์มมีลักษณะเรียบเนียน เมื่อเวลาเคลือบเพิ่มขึ้นเป็น 60 นาที พบว่าเกรนของฟิล์มเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มหนาแน่นมากขึ้น มีลักษณะกลมมน เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พบว่าเกรนของฟิล์มรวมตัวมากขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายจึงเปลี่ยนเป็นกลุ่มของเกรนที่มีขนาดใหญ่ทั่วบริเวณพื้นผิวหน้าฟิล์ม

สำหรับความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์ ที่เคลือบโดยแบร์ค่าเวลาเคลือบ พบร่วมกับเมื่อเวลาเคลือบเพิ่มขึ้นจาก 30 นาที ถึง 150 นาที ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 132 nm ถึง 599 nm และ 0.41 nm ถึง 0.85 nm ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 4-9



ภาพที่ 4-12 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์ ที่เวลาเคลือบต่างๆ วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM

(a) 30 นาที, (b) 60 นาที, (c) 90 นาที, (d) 120 นาที, และ (e) 150 นาที



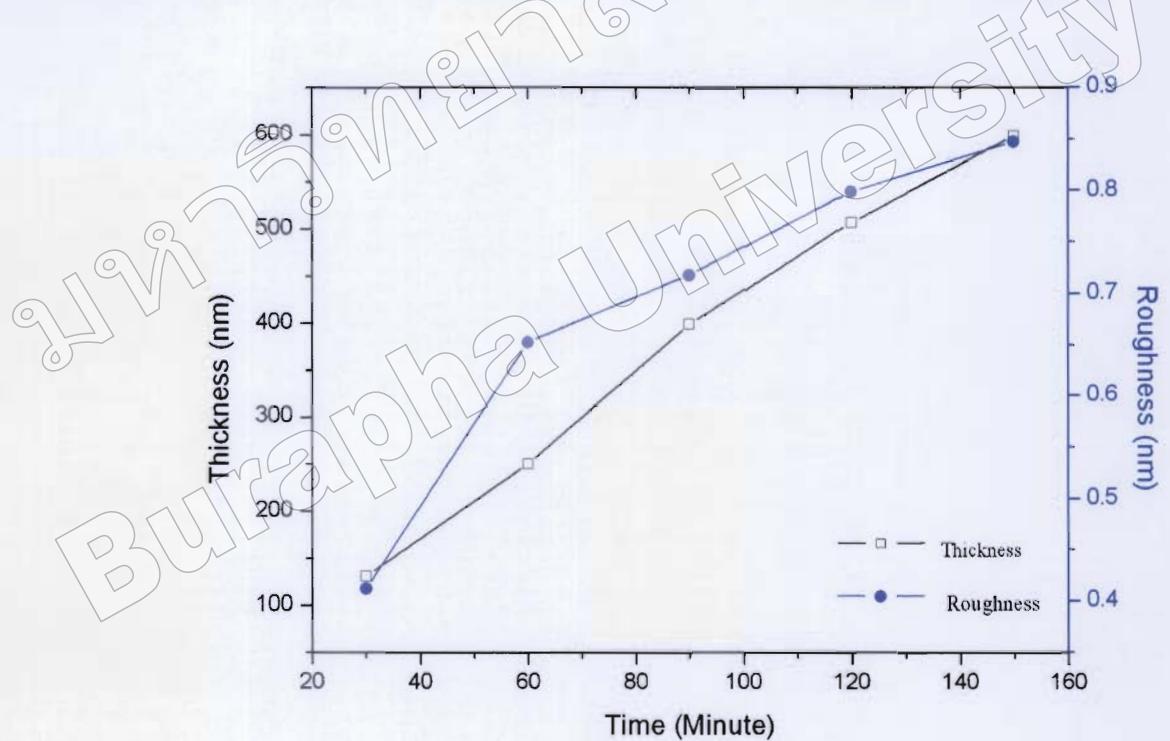
ภาพที่ 4-12 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์

ที่เวลาเคลื่อนต่าง ๆ วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM

(a) 30 นาที, (b) 60 นาที, (c) 90 นาที, (d) 120 นาที, และ (e) 150 นาที

ตารางที่ 4-9 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางเซอร์โคโน่ยมในไตรด์ที่เวลาเคลื่อนต่าง ๆ

เวลาเคลื่อน (นาที)	ความหนา (nm)	ความหยาบผิว (nm)
30	132	0.41
60	250	0.65
90	398	0.78
120	508	0.80
150	599	0.85



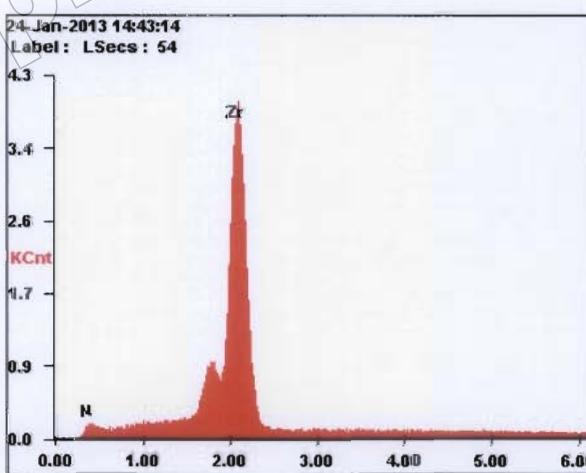
ภาพที่ 4-13 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางเซอร์โคโน่ยมในไตรด์ที่เวลาเคลื่อนต่าง ๆ

4. องค์ประกอบของชาตุทางเคมีฟิล์มบางช่อร์โโคเนียมในไตรด์

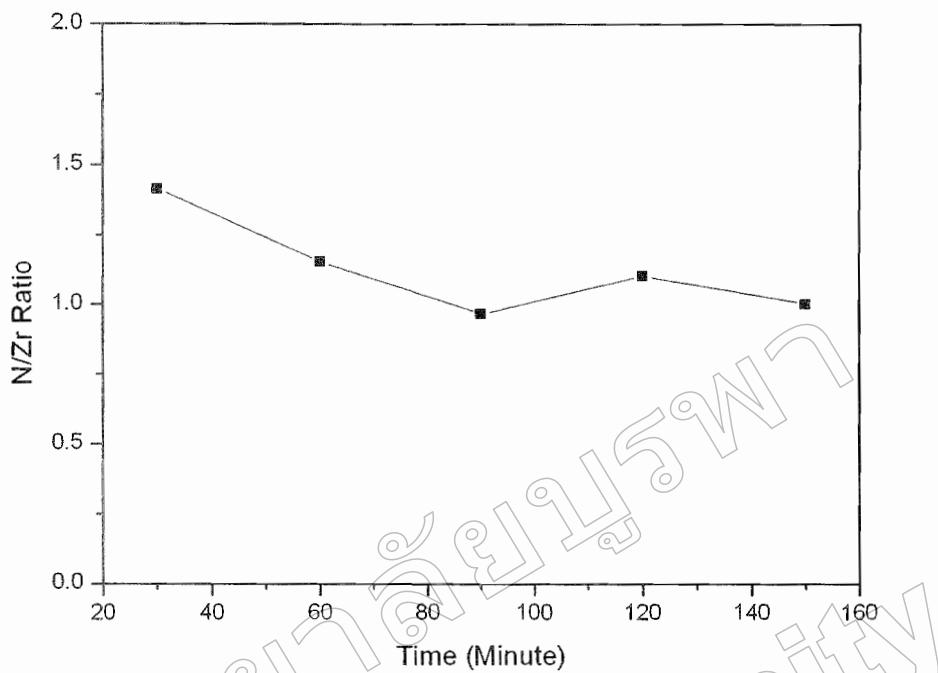
การศึกษาองค์ประกอบชาตุทางเคมีของฟิล์มเชอร์โนเนียมในไตรด์ด้วยเทคนิค EDX พบว่า ฟิล์มที่เคลือบได้มีเชอร์โโคเนียมและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบชาตุของฟิล์ม โดยค่าเบอร์เซ็นโดยจำนวนอะตอม ($a\%$) ของเชอร์โโคเนียมและไนโตรเจนในฟิล์มที่เคลือบได้ แสดงดังตารางที่ 4-10 ส่วนภาพที่ 4-14 เป็นตัวอย่างผล EDX ของฟิล์มเชอร์โโคเนียมในไตรด์ เคลือบที่เวลา 150 นาที ทั้งนี้พบว่าอัตราส่วน $N : Zr$ มีค่าค่อนข้างคงที่ประมาณ 1 แสดงดังภาพที่ 4-15

ตารางที่ 4-10 องค์ประกอบทางเคมีและอัตราส่วนของ $N : Zr$ ของฟิล์มบางช่อร์โโคเนียมในไตรด์ ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ

เวลาเคลือบ (นาที)	เบอร์เซ็นโดยจำนวนอะตอม ($a\%$)		$N : Zr$
	Zr	N	
30	41.43	58.57	1.41
60	46.43	53.57	1.15
90	51.90	48.10	0.93
120	47.58	52.42	1.10
150	49.90	50.10	1.00



ภาพที่ 4-14 ตัวอย่างผล EDX ของฟิล์มเชอร์โโคเนียมในไตรด์เคลือบที่เวลา 150 นาที



ภาพที่ 4-15 อัตราส่วน N : Zr ของฟิล์มนางเซอร์โคเนียม ในไตรค์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDX

5. สีของฟิล์มนางเซอร์โคเนียมในไตรค์

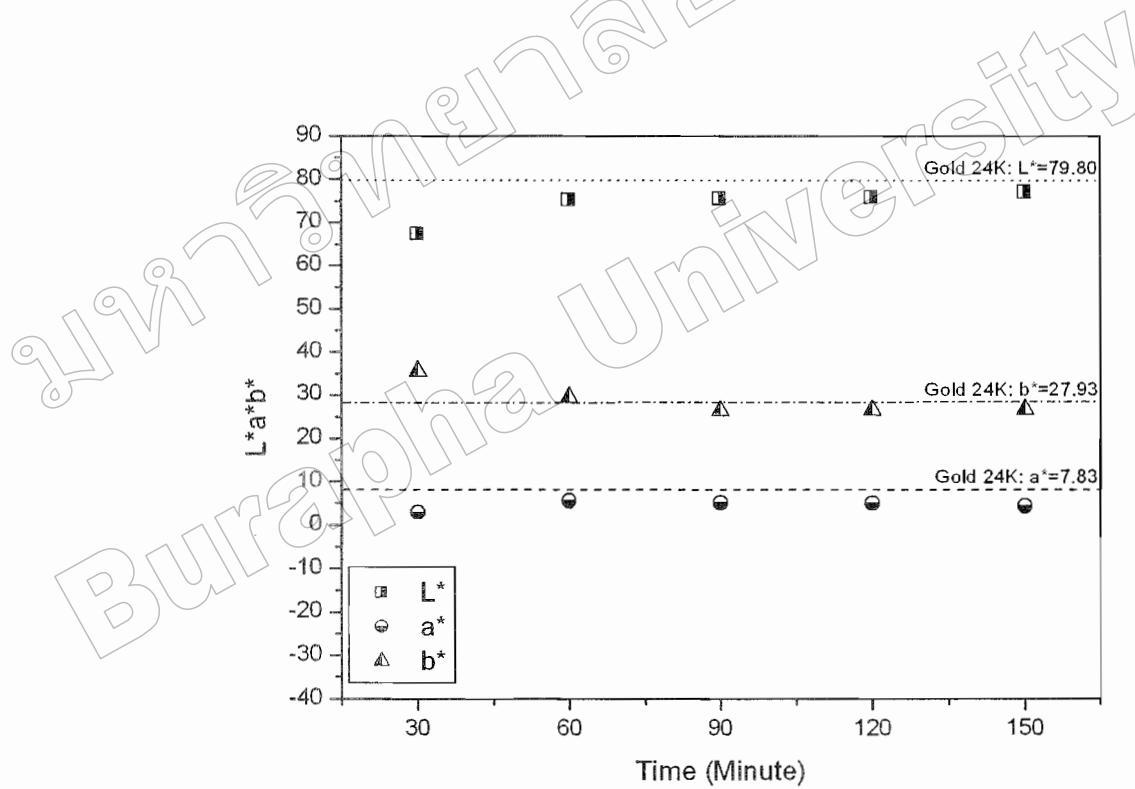
สีของฟิล์มนางเซอร์โคเนียมในไตรค์ ในงานวิจัยนี้นักวิจัยได้ทดสอบค่าสีระบบ CIE L*a*b* ที่วัดจากเครื่อง spectrophotometer จากงานวิจัยพบว่าค่า L*a*b* ของฟิล์มที่เวลาเคลือบต่าง ๆ มีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้นเวลาเคลือบค่อนข้างไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสี แสดงดังตารางที่ 4-11

การเปรียบเทียบค่า L*a*b* ของฟิล์มนางเซอร์โคเนียมในไตรค์ กับค่า L*a*b* ของ

ทอง 24 กะรัต พบร่วมกับฟิล์มนางเซอร์โคเนียมในไตรค์ที่เคลือบได้มีค่าใกล้เคียงกับ L*a*b* ของ
ทอง 24 กะรัต โดยทอง 24 กะรัตมีค่า $L^* = 79.80$, $a^* = 7.83$ และ $b^* = 27.93$ (Li and Zhang., 1994)
ตามลำดับ แสดงดังภาพที่ 4-16

ตารางที่ 4-11 สีของฟิล์มบางเซอร์โคเนียม ในไตรค์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ

เวลาการเคลือบ (นาที)	ปริภูมิสีระบบ L*a*b		
	L*	a*	b*
30	67.33	2.93	35.61
60	75.21	5.53	29.52
90	75.65	5.08	26.42
120	75.93	5.05	26.56
150	77.16	4.31	26.74



ภาพที่ 4-16 สีของฟิล์มบางเซอร์โคเนียม ในไตรค์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ ในระบบ CIE L*a*b*
เปรียบเทียบกับสีของทอง 24 กะรัต